# 日本国特許庁 PATENT OFFICE

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて る事項と同一であることを証明する。

his is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed this Office.

願年月日 te of Application:

1997年 9月20日

願番号 Lication Number:

平成 9年特許願第273458号

顧 人 cant (s):

株式会社半導体エネルギー研究所

# CERTIFIED COPY OF DIORITY DOCUMENT

1998年 7月24日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Patent Office 保佑山建門

出証番号 出証特平10-3059179

# 特平 9-273458

【書類名】 特許願

【整理番号】 P003740-08

【提出日】 平成 9年 9月20日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H01L 21/00

【発明の名称】 イメージセンサおよびイメージセンサー体型アクティブ

マトリクス型表示装置

【請求項の数】 23

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半導体エネル

ギー研究所内

【氏名】 張宏勇

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半導体エネル

ギー研究所内

【氏名】 坂倉 真之

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半導体エネル

ギー研究所内

【氏名】 佐藤 由里香

【特許出願人】

【識別番号】 000153878

【氏名又は名称】 株式会社半導体エネルギー研究所

【代表者】 山崎 舜平

【手数料の表示】

【納付方法】 予納

【予納台帳番号】 002543

【納付金額】 21,000円

# 【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

# 【書類名】 明細書

【発明の名称】 イメージセンサおよびイメージセンサー体型アクティブマトリクス型表示装置

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の受光画素が配置された受光画素領域に、光を電荷に変換する受光部と、前記受光部で発生した電荷を信号として読み出す信号読出し部とが積層されたイメージセンサであって、

前記受光部は、前記受光画素ごとに分離された複数の下部電極と、光電変換層と、前記受光画素に共通な上部電極とを有し、

前記イメージセンサは、前記上部電極と異なる層に形成された取出し端子を有し、

前記受光画素領域外部において、前記上部電極は前記取出し端子と光入射側で接続されていることを特徴とするイメージセンサ。

【請求項2】 請求項1において、前記取出し端子は前記下部電極と同じ出発 膜でなる第2の取出し端子に接続されていることを特徴とするイメージセンサ。

【請求項3】 請求項1において、前記信号読出し部は、信号を読み出す前記 受光画素を選択するための信号が入力される選択線を有し、

前記取出し端子は前記選択線または前記選択線と同じ出発膜でなる第2の取出 し配線に接続されていることを特徴とするイメージセンサ。

【請求項4】 請求項1において、前記信号読出し部は、信号を読み出す前記 受光画素を選択するための信号が入力される選択線を有し、

前記取出し端子は、前記下部電極と同じ出発膜でなる第2の取出し端子に接続 され、

前記第2の取出し端子は前記選択線と同じ出発膜でなる第3の取出し配線に接続されていることを特徴とするイメージセンサ。

【請求項5】 請求項1において、請求項1において、前記信号読出し部は、 読み出した信号を出力するため信号線を有し、

前記取出し端子は前記信号線と同じ出発膜でなる第2の取出し配線に接続されていることを特徴とするイメージセンサ。

【請求項6】 請求項1において、前記信号読出し部は、読み出した信号を出力するため信号線を有し、

前記取出し端子は、前記下部電極と同じ出発膜でなる第2の取出し端子に接続され、

前記第2の取出し端子は前記信号線と同じ出発膜でなる第3の取出し配線に接続されていることを特徴とするイメージセンサ。

【請求項7】 請求項1~6において、前記光電変換層は、前記上部電極をマスクにしてパターニングされていることを特徴とするイメージセンサ。

【請求項8】 請求項1~7において、前記信号読出し部は、薄膜トランジスタで構成されていることを特徴とするイメージセンサ。

【請求項9】 複数の選択線と複数の信号線が格子状に配置され、複数の画素 電極を有する表示マトリクスと、

複数の受光画素が配置された受光画素領域に、光を電荷に変換する受光部と、 前記受光部で発生した電荷を信号として読み出す信号読出し部とが積層されたイ メージセンサと、

を同一基板上に有するアクティブマトリクス型表示装置であって、

前記受光部は、前記受光画素ごとに分離された複数の下部電極と、光電変換層と、前記受光画素に共通な上部電極とを有し、

前記上部電極は、光入射側で取出し端子に接続され、

前記取出し端子は前記上部電極と異なる層に形成されていることを特徴とする イメージセンサー体型アクティブマトリクス型表示装置。

【請求項10】 請求項9において、前記取出し端子は、前記画素電極と同じ 出発膜で形成されていることを特徴とするイメージセンサー体型アクティブマト リクス型表示装置。

【請求項11】 請求項9又は10において、前記取出し端子は、前記選択線 もしくは前記信号線と同一の出発膜でなる第2の取出し端子に接続されているこ とを特徴とするイメージセンサー体型アクティブマトリクス型表示装置。

【請求項12】 複数の選択線と複数の信号線が格子状に配置され、複数の画素電極と、前記画素電極に接続された能動素子とを有する表示マトリクスと、

複数の受光画素が配置された受光画素領域に、光を電荷に変換する受光部と、 前記受光部で発生した電荷を信号として読み出す信号読出し部とが積層されたイ メージセンサと、

を同一基板上に有するアクティブマトリクス型表示装置であって、

前記表示マトリクスは、前記信号線及び前記選択線を少なくとも覆う電極層を 有し、

前記受光部は、前記受光画素ごとに分離され、前記電極層と同じ出発膜で形成された複数の下部電極と、光電変換層と、前記受光画素に共通な上部電極とを有し、

前記上部電極は、光入射側で取出し端子に接続され、

前記取出し端子は前記上部電極と異なる層に形成されていることを特徴とする イメージセンサー体型アクティブマトリクス型表示装置。

【請求項13】 請求項12において、前記取出し端子は、前記画素電極と同じ出発膜で形成されていることを特徴とするイメージセンサー体型アクティブマトリクス型表示装置。

【請求項14】 請求項12又は13において、前記取出し端子は前記選択線 もしくは前記信号線と同一の出発膜でなる第2の取出し端子に接続されている。

【請求項15】 請求項12又は13において、前記取出し端子は、前記電極層と同一の出発膜でなる第2の取出し端子に接続されていることを特徴とするイメージセンサー体型アクティブマトリクス型表示装置。

【請求項16】 請求項12又は13において、前記取出し端子は、前記電極層と同一の出発膜でなる第2の取出し端子に接続され、前記第2の取出し端子は前記選択線もしくは前記信号線と同一の出発膜でなる第3の取出し端子に接続されていることを特徴とするイメージセンサー体型アクティブマトリクス型表示装置。

【請求項17】 複数の信号線と複数の選択線が格子状に配置され、複数の表示画素を備えた表示マトリクスと、

複数の受光画素が配置された受光画素領域に、光を電荷に変換する受光部と、 前記受光部で発生した電荷を信号として読み出す信号読出し部とが積層されたイ メージセンサと、

を同一基板上に有するアクティブマトリクス型表示装置であって、

前記画素マトリクスは、

前記基板上に形成され、前記信号線及び前記選択線に接続された能動素子と、 前記能動素子を覆う第1の絶縁膜と、

前記第1の絶縁膜上に形成され、前記信号線及び前記選択線とを少なくとも覆 う電極層と、

前記電極層上に形成された第2の絶縁膜と、

前記第2の絶縁膜上に形成され前記能動素子に接続された画素電極と、

を有し、

前記イメージセンサは、

前記基板上に形成された前記信号読出し部と、

前記信号読出し部を覆う前記第1の絶縁膜と、

前記第1の絶縁膜上に形成され前記電極層と同じ出発膜でなり、前記受光画素 ごとに分離された複数の下部電極と、

前記下部電極上に形成された光電変換層と、

前記光電変換層上に形成され、前記受光画素に共通な上部電極と、

前記上部電極を覆う前記第2の絶縁膜と、

前記第2の絶縁膜上に形成され、前記上部電極に接続された取出し端子と、 を有し、

前記上部電極は、前記画素電極と同じ出発膜で形成されていることを特徴とするイメージセンサー体型アクティブマトリクス型表示装置。

【請求項18】 請求項17において、前記取出し端子は、前記選択線もしく は前記信号線と同一の出発膜でなる第2の取出し端子に接続されていることを特 徴とするイメージセンサー体型アクティブマトリクス型表示装置。

【請求項19】 請求項17において、前記取出し端子は、前記電極層と同一の出発膜でなる第2の取出し端子に接続されていることを特徴とするイメージセンサー体型アクティブマトリクス型表示装置。

【請求項20】 請求項17において、前記取出し端子は、前記電極層と同一

4

の出発膜でなる第2の取出し端子に接続され、前記第2の取出し端子は前記選択 線もしくは前記信号線と同一の出発膜でなる第3の取出し端子に接続されている ことを特徴とするイメージセンサー体型アクティブマトリクス型表示装置。

【請求項21】 請求項9~20において、前記基板上には、信号読出し部に接続された周辺回路が設けられており、前記取出し端子は前記周辺回路との接続部を除いた前記受光マトリクスの周囲を少なくとも囲んで形成されていることを特徴とするイメージセンサー体型アクティブマトリクス型表示装置。

【請求項22】 請求項9~21において、前記光電変換層は、前記上部電極をマスクにしてパターニングされていることを特徴とするイメージセンサー体型アクティブマトリクス型表示装置。

【請求項23】 請求項9~22において、前記能動素子及び前記信号読出し 部は、薄膜トランジスタで構成されていることを特徴とするイメージセンサー体 型アクティブマトリクス型表示装置。

# 【発明の詳細な説明】

[0001]

#### 【発明の属する技術分野】

本発明は、光を電荷に変換する受光部と、受光画素を走査して、受光部で発生 した電荷を信号として読み出す走査回路を有するイメージセンサに関するもので あり、特に走査回路上に受光部を積層した積層型のイメージセンサに関するもの である。

[0002]

更に、他の発明は積層型のイメージセンサと表示マトリクスとを一体化したアクティブマトリクス型表示装置に関するものである。

[0003]

#### 【従来の技術】

光センサは、光を電気信号に変換するセンサとして広く用いられている。例えば、ファクシミリ、複写機、ビデオカメラ、デジタルスチルカメラ等のイメージセンサとして広く使用されている。

[0004]

マルチメディアの要求に対応するため、イメージセンサの画素の高密度化が急激に進んでいる。例えば、デジタルスチルカメラの画素の規格はVGA(640×480=31万画素)から、SVGA、XGAへと高密度化され、更にSXGA(1280×1024=131万画素)へと高密度化が進んでいる。

#### [0005]

また、デジタルスチルカメラ等のマルチメディアツールの小型化、低コスト化の要求から、光学系は2/3 inchから1/2 inch、1/3 inch、1/4 inchへと年々小型化されている。

#### [0006]

このように、画素の高密度化、光学系の小型化を実現するうえで、小さな受光 セルであって、変換効率の良いイメージセンサが要求される。この要求を満足す るため、例えば開口率を向上するため、受光部で発生した電荷を信号として読み 出す走査回路と、受光部(フォトダイオード部)とを積層した積層型イメージセ ンサが提案されている。

#### [0007]

近年、ポリシリコンTFTと呼ばれる多結晶シリコンを用いたTFTする技術が鋭意研究されている。その成果として、ポリシリコンTFTによって、シフトレジスタ回路等の駆動回路を作製することが可能になり、表示マトリクスと、表示マトリクスを駆動する周辺駆動回路とを同一基板上に集積したアクティブマトリクス型の液晶パネル実用化に至っている。そのため、液晶パネルが低コスト化、小型化、軽量化されたため、パーソナルコンピュータ、携帯電話、ビデオカメラやデジタルカメラ等の各種情報機器、携帯機器の表示部に用いられている。

#### [0008]

現在、ノート型パソコンよりも携帯性に優れ、安価なポケットサイズの小型携帯用情報処理端末装置が実用化されており、その表示部にはアクティブマトリクス型液晶パネルが用いられている。このような情報処理端末装置は表示部からタッチペン方式でデータを入力可能となっているが、紙面上の文字・図画情報や、映像情報を入力するには、スキャナーやデジタルカメラ等の周辺機器が必要である。そのため、情報処理端末装置の携帯性が損なわれてしまっている。また、使

用者に周辺機器を購入するための経済的な負担をかけている。

[0009]

また、アクティブマトリクス型表示装置は、TV会議システム、TV電話、インターネット用端末等の表示部にも用いられている。これらシステムや、端末では、対話者や使用者の映像を撮影するカメラを備えているが、表示部とカメラ部は個別に製造されてモジュール化されている。

[0010]

#### 【発明が解決しようとする課題】

本発明では、積層型のイメージセンサにおいて、さらなる開口率の向上を図ることを課題とし、特に、受光部の光入射側の上部電極を定電位に固定するための取出し端子の構造に関する。

[0011]

本発明の目的は、上述した問題点を解消し、表示マトリクス、周辺回路が形成される基板上に、イメージセンサを設けることにより、撮像機能と表示機能とを兼ね備えたインテリジェント化されたアクティブマトリクス型表示装置をすることにある。

[0012]

#### 【課題を解決するための手段】

上述の課題を解決するために本発明は、複数の受光画素が配置された受光画素領域に、光を電荷に変換する受光部と、前記受光部で発生した電荷を信号として読み出す信号読出し部とが積層されたイメージセンサであって、

前記受光部は、前記受光画素ごとに分離された複数の下部電極と、光電変換層と、前記受光画素に共通な上部電極とを有し、

前記イメージセンサは、前記上部電極と異なる層に形成された取出し端子を有し、

前記受光画素領域外部において、前記上部電極は前記取出し端子と光入射側で接続されていることを特徴とする。

[0013]

更に、本発明は、複数の選択線と複数の信号線が格子状に配置され、複数の画

素電極を有する表示マトリクスと、複数の受光画素が配置された受光画素領域に、光を電荷に変換する受光部と、前記受光部で発生した電荷を信号として読み出す信号読出し部とが積層されたイメージセンサとを同一基板上に有するアクティブマトリクス型表示装置であって、

前記受光部は、前記受光画素ごとに分離された複数の下部電極と、光電変換層と、前記受光画素に共通な上部電極とを有し、前記上部電極は、光入射側で取出 し端子に接続され、前記取出し端子は前記上部電極と異なる層に形成されている ことを特徴とする。

#### [0014]

更に、上記イメージセンサー体型アクティブマトリクス型表示装置において、 前記信号線及び前記選択線を少なくとも覆う電極層を形成し、かつ受光部の下部 電極を前記電極層と同じ出発膜で形成されすることを特徴とする。

#### [0015]

更に、イメージセンサー体型アクティブマトリクス型表示装置において、 前記画素マトリクスは、前記基板上に形成され、前記信号線及び前記選択線に接 続された能動素子と、前記能動素子を覆う第1の絶縁膜と、前記第1の絶縁膜上 に形成され、前記信号線及び前記選択線とを少なくとも覆う電極層と、前記電極 層上に形成された第2の絶縁膜と、前記第2の絶縁膜上に形成され、前記能動素 子に接続された画素電極とを有し、

前記イメージセンサは、前記基板上に形成された前記信号読出し部と、前記信号読出し部を覆う前記第1の絶縁膜と、前記第1の絶縁膜上に形成され前記電極層と同じ出発膜でなり、前記受光画素ごとに分離された複数の下部電極と、前記下部電極上に形成された光電変換層と、前記光電変換層上に形成され、前記受光画素に共通な上部電極と、前記上部電極を覆う前記第2の絶縁膜と、前記第2の絶縁膜上に形成され、前記上部電極に接続された取出し端子とを有し、

前記上部電極は、前記画素電極と同じ出発膜で形成されていることを特徴とする。

#### [0016]

【発明の実施形態】

図1を用いて、本実施形態の周辺回路一体型のアクティブマトリクス型表示装置において、素子基板にイメージセンサを一体的に設けた表示装置を説明する。

[0017]

基板500上には、画素マトリクス111と表示マトリクス121が形成されている。表示マトリクス121には、信号線307及び選択線302が格子状に配列され、この格子内に、信号線307及び選択線302接続されたTFTでなる能動素子が表示画素ごとに配置されている。

[0018]

表示マトリクス121には、TFTを覆う第1の絶縁層540と、第1の絶縁層540上に形成され、選択線302及び信号線307とを少なくとも覆う電極層308が配置されている。図1において、電極層308は分断されているように図示されているが、格子状に一体的に配置されている。

[0019]

電極層308上には第2の絶縁膜550が形成され、第2の絶縁膜550上には画素電極312が形成されている。画素電極312は第1、第2の絶縁膜540、550に設けられたコンタクトホールを介して表示マトリクスのTFTに接続されている。

[0020]

電極層308は、表示マトリクス121に配置されている能動素子に光が入射するのを防止すると共に、有効表示領域からの光が表示に寄与して、表示特性が劣化するのを防いでいる。また電極層308の電位を固定することにより、選択線302、信号線306の電位の変動が、画素電極312の電位にフィードバックされることが防止できる。

[0021]

他方、受光マトリクス111には、信号読取り部として、TFTをスイッチング素子として用い受光画素を走査するための走査回路が配置されている。信号読取り部は、表示部の能動素子と同様、第1の絶縁膜540に覆われている。第1の絶縁層540上には、受光部が形成されている。第2の絶縁ゲイト型半導体素子により、受光部で発生した電荷、もしくは受光部の電位の変化が信号として読

み出される。

[0022]

受光部は、受光画素ごとに分離された複数の下部電極208と、下部電極20 8上に形成された光電変換層210と、光電変換層210上に形成され、受光画素に共通な上部電極212とで構成されている。下部電極212は電極層308と同じ出発膜で形成されている。受光部は第2の絶縁膜550によってパッシベーションされている。

[0023]

光電変換膜210は真性もしくは実質的に真性な非晶質シリコンや非晶質シリコンゲルマニューム等のシリコン系半導体を用いることができる。pin接合を有するシリコン系半導体膜を用いることもできる。また受光部をフォトコンダクタとする場合には、一般に固体撮像管に用いられてるZnSe/ZnCdTe膜や、Se/Te/As等の積層膜を用いることができる。

[0024]

なお、図1において、膜209、膜211は非晶質シリコンでなる光電変換層210を下部電極208、上部電極212にオーミック接合させるためのn型、p型非晶質シリコン膜である。なお、n型非晶質シリコン膜209の代わりに、非晶質シリコン膜210のバリア膜として機能する膜を設けても良い。この場合、リン等のn型不純物が添加された酸化珪素膜、窒化珪素膜、炭化珪素膜等を用いることができる。

[0025]

上部電極212の電位を固定するために、前記受光マトリクス111外部において、受光部の上部電極212は、第2の絶縁膜550に設けられたコンタクトホールを介して、画素電極312と同じ出発膜でなる取出し配線606に接続されている。

[0026]

更に、取出し配線606は、電極層308と同じ出発膜でなる取出し端子60 3に接続され、さらに取出し端子603は信号線307と同じ出発膜でなる取出 し端子601に接続されている。取出し端子601は基板外部の配線との接続部 となる外部端子に、直接もしくは他の配線を介して接続されている。取出し端子 601を一定電位に固定することにより、上部電極212の電位が一定に固定できる。

[0027]

積層型イメージセンサにおいて、開口部が全て上部電極212に覆われ、その電位が一定に固定されるため、光入射側から侵入する雑音を上部電極212にてシールドすることができる。さらに、本実施形態では、受光部の側面は、端子601、603、606で囲まれ、これら端子の電位は一定に固定されるため、受光部側面からの雑音が侵入することも抑制できる。よって、S/N比が向上でき、高性能、高信頼性のイメージセンサを提供できる

[0028]

本実施形態では、表示マトリクス121と受光マトリクス111を同一基板上に形成するために、成膜プロセス及びパターニングプロセスを各マトリクス11 1、121とで共通化することを特徴とする。絶縁膜540、550を各マトリクス111、121で共有する。

[0029]

更に電極層308と下部電極208、画素電極312と取出し端子606とを同一の成膜プロセス及びパターニングプロセスで形成する。これにより、追加工程を最小限にして、イメージセンサー体型のアクティブマトリクス型表示装置を提供することが可能であり、製造コストを安価におさえることができる。

[0030]

また本実施形態では、受光部の上部電極212の電位を固定するために、上部電極212を外部端子に接続するための取出し端子606を、上部電極212と 一体的に形成せずい点に特徴を有する。この取出し端子606を上部電極212 と異なる層に形成し、かつ上部電極212の光入射側で接続することにある。

[0031]

この取出し端子606を上部電極212と一体的に形成した場合には、上部電極212と光電変換層210とのパターンが異り、上部電極212のパターニング工程は光電変換層210と異なることとなる。このため、上部電極212のパ

ターニングのマスクずれにより、開口率が低下するおそれがある。

[0032]

他方、上部電極212と取出し端子とをそれぞれ異なる層に配置された導電膜で構成することにより、1つのレジストマスクを用いて、上部電極212と光電変換層210とのパターニングを連続して行うことが可能になり、マスクずれによる開口率の低下を防止するという効果を得る。更に光電変換層210をパターニングする際に、光電変換層210上には上部電極212が存在するため、光電変換層210のパターニングプロセス時のダメージを抑制することができる。

[0033]

本実施形態では、上部電極212と取出し端子606とをそれぞれ異なる層に配置された導電膜で構成する。上部電極212と光電変換層210とを同じプロセスでパターニングするには、この導電膜は上部電極212よりも上部に形成することも重要であり、取出し端子606を上部電極212の光入射側で接続させる。またこの取出し端子606を画素電極312と同じプロセスによって形成することにより、アクティブ型表示装置の製造プロセスとの整合性をとる。

[0034]

【実施例】 図1~図16を用いて、本発明の実施例を詳細に説明する。

[0035]

[実施例1] 本実施例は、イメージセンサと表示マトリクスとを同一基板上 に備えた透過型液晶表示装置に関するものである。

[0036]

図2は、本実施例の液晶表示装置の正面図である。図2に示すように基板100上には、受光領域110と表示領域120とが共に設けられている。受光領域110には、複数の受光画素がマトリクス状に配置された受光マトリクス111と、受光マトリクス111に接続された周辺回路112と、周辺回路が接続されていない受光マトリクス111の周囲を囲むように、取出し端子が配置される端子部113とが形成されている。受光マトリクス111は、受光部(フォトダイオード)と、受光部で発生した電荷を信号として読み出すための半導体素子が積層した構造を有する。

[0037]

他方、表示領域120は、画素電極と画素電極に接続された能動素子とが配置された表示マトリクス121と、表示マトリクス121配置された能動素子を駆動するための周辺駆動回路122とが設けられている。更に、基板100上には、基板外部の電源線等の配線との接続部となる外部取出し端子部130が設けられている。

[0038]

本実施例では、受光マトリクス111の絶縁ゲイト型半導体素子、表示マトリクス121の能動素子、及び周辺駆動回路112、122に配置される半導体素子を、CMOS技術を用いてTFT(薄膜トランジスタ)にて同時に作製する。 以下に本実施例の液晶パネルの作製方法を説明する。

[0039]

図3、図4には、受光マトリクス111、取出し端子部113及び表示マトリクス121の断面図を示す。また、図5~図8には受光領域121の作製過程を示す正面図を示し、図9~図12には表示マトリクス121の作製過程を示す正面図を示し、図13、図14には周辺回路112、122に配置されるCMOS-TFTの作製過程を示す正面図を示す。

[0040]

まず図3(A)に示すように、ガラス基板500全面に、基板からの不純物の 拡散を防止するための下地膜510を形成する。下地膜510として、プラズマ CVD法によって、酸化珪素膜を200nmの厚さに形成する。

[0041]

図3 (A)の受光マトリクス111、表示マトリクス121及びCMOS-T FTの正面図が図5、図9、図13に相当する。図5、図9において線A-A'、線B-B'に沿った断面図が図3 (A)に対応する。

[0042]

本実施例では透過型液晶パネルを作製するため、基板500は可視光を透過する基板であれば良く、ガラス基板500の代わりに石英基板等も用いることができる。なお、本実施例では、TFTを多結晶シリコン膜で形成するため、基板5

00は多結晶シリコン膜の形成プロセスに耐え得るものを選択する。多結晶シリコン膜は移動度が10~200cm<sup>2</sup> /Vsec程度と非常に大きく、多結晶シリコンでTFTのチャネル形成領域を構成することにより、高速応答させることができ、特に、受光マトリクス110のTFTや、周辺駆動回路112、122のCMOS-TFTに有効である。

## [0043]

次に、プラズマCVD法によって非晶質シリコン膜を55nmの厚さに成膜し、エキシマレーザ光を照射して、多結晶化する。非晶質珪素膜の結晶化方法として、SPCと呼ばれる熱結晶化法、赤外線を照射するRTA法、熱結晶化とレーザアニールとを併用する方法等を用いることができる。

#### [0044]

次に、多結晶化されたシリコン膜を島状にパターニングして、TFTの活性層 201、301、401、402を形成する。次に、これら活性層 201、301、401、402を覆うゲイト絶縁膜 520を形成する。ゲイト絶縁膜 520はシラン( $SiH_4$ )と $N_2$ Oを原料ガスに用いて、プラズマCVD法で 120nmの厚さに形成する。

#### [0045]

次に、A1、Cr、Mo等の金属や導電性ポリシリコン膜等の導電膜を成膜しパターニングして、選択線202、302、ゲイト電極403を形成する。これら配線・電極202、302、403をマスクにして、公知のCMOS技術を用いて活性層201、301、401、402に導電性を付与する不純物をドーピングしてソース及びドレイン領域を形成する。

#### [0046]

活性層201、301及び401にリンをドープすることにより、N型のソース領域203、303、405、ドレイン領域204、304チャネル形成領域204、305が自己整合的に形成される。活性層201、301、401をレジストマスクで覆い、活性層402のみにボロンをドープして、P型のソース領域およびドレイン領域と、チャネル形成領域を自己整合的に形成する。ドーピング後、ドーピングされた不純物を活性化する。

[0047]

なお、本実施例では活性層201、301、401が多結晶シリコンであるため、配線・電極202、302、403を形成する前に、少なくともNチャネル型TFTのチャネル形成領域205、305、407となる領域にボロン等のP型の不純物を添加して、しきい値を最適化するのが好ましい。

[0048]

次に、図3(B)に示すように、基板500全面を覆う第1の層間絶縁膜530を形成する。層間絶縁膜530に各TFTのソース領域およびドレイン領域に達するコンタクトホール及びCMOS-TFTのゲイト電極403に達するコンタクトホールをそれぞれ形成する。しかる後、チタン膜、アルミニウム膜、チタン膜でなる積層膜を形成し、パターニングして、受光マトリクス111の信号線206、ソース電極207と、表示マトリクス121の信号線306、ドレイン電極307がそれぞれ形成される。

[0049]

この状態の受光マトリクス111、表示マトリクス121の正面図が図6、図10に相当する。図6、図10において線A-A'、線B-B'に沿った断面図が図3(A)に対応する。

[0050]

更にCMOS-TFTには、図14に示すようにゲイト電極403に接続される入力配線411、nチャネル型TFTのソース領域に接続される配線412、pチャネル型TFTのドレイン領域に接続される配線413、nチャネル型TFTのドレイン領域406とpチャネル型TFTのソース領域408とを接続する配線414を形成する。

[0051]

図6に示すように、受光マトリクス111において、選択線202は周辺回路122Hに接続され、周辺回路122Hから、受光部で発生した信号電荷を読み取る受光画素を指定する選択信号が入力される。また信号線206は周辺回路112Vに接続され、読み出された信号電荷は、信号線206を経て周辺回路112Vに出力され、周辺回路112Vから映像信号として外部に出力される。

[0052]

さらに、取出し端子部113には、取出し端子601が形成される。図6に示すように、取出し端子601は、受光マトリクス111の周囲であって周辺駆動回路112が接続されていない周囲に沿って『L』字型に形成されている。更に取出し端子601は受光領域110外部に延在する部分を有し、この部分で外部取出し端子部130に形成された端子に接続されている。

[0053]

更に、表示領域120内において、表示マトリクス121外部に後に形成される電極層308の電位を固定するための端子602も形成される。

[0054]

以上のCMOSプロセスを経て、多結晶シリコンTFTを用いた受光マトリクス111、表示マトリクス121及び駆動回路112、122に配置されるCMOS-TFTが同時に完成する。ここでは、これらTFTをトップゲイトのプラナ型としたが、逆スタガ等のボトムゲイト型としてもよい。この場合、活性層201、301、401、402と選択線202、302、ゲイト電極403の形成順序を逆にし、選択線202、302、ゲイト電極403を形成した後、ゲイト絶縁膜520を形成すればよい。また、LDD領域やオフセット領域を設けてもよい。

[0055]

次に、図3(C)に示すように、受光部TFT200と受光部とを絶縁分離するための第2の層間絶縁膜540を基板500全面に形成する。第2の層間絶縁膜540には下層の凹凸を相殺して、平坦な表面が得られる樹脂膜が好適である。このような樹脂膜として、ポリイミド、ポリアミド、ポリイミドアミド、アクリルを用いることができる。また、第2の層間絶縁膜540の表面層は平坦な表面を得るため樹脂膜とし、下層は酸化珪素、窒化珪素、酸化窒化珪素等の無機絶縁材料の単層、多層としても良い。本実施例では、第2の層間絶縁膜540としてポリイミド膜を1.5μmの厚さに形成する。

[0056]

次に、第2の層間絶縁膜540に、ソース電極207、ドレイン電極307、

端子601、602に達するコンタクトホールをそれぞれ形成した後、受光部の下部電極、及び表示マトリクスの電極層を構成するTi、Cr、Mo、Al等の 導電膜11を形成する。本実施例では導電膜として厚さ200nmのチタン膜1 1をスッパタ法で成膜する。

#### [0057]

次に、受光部の光電変換層と下部電極とをオーミック接合させるためのn型の 非晶質シリコン膜12を30~50nmの厚さに、ここでは30nmの厚さに基 板全面に成膜する。チタン膜11及びシリコン膜12をパターニングするための レジストマスク13を形成する。

#### [0058]

レジストマスク13を用いて、図4(A)に示すようにシリコン膜12、チタン膜11を順次パターニングする。ここでは、ドライエッチング法を用いる。シリコン膜12のエッチングガスには $CF_4$ を $1\sim10$ %混合した $O_2$ ガスを用いる。本実施例では $CF_4$ の濃度を5%とする。またチタン膜11のエッチングガスには $C1_2$  /BC $1_3$ /SiC $1_4$ を混合した塩素系ガスを用いる。なお、チタン膜11は樹脂でなる絶縁膜540上に形成されるため、チタン膜11のエッチングガス、エッチャントは樹脂を変質しないものを選択する必要がある。

## [0059]

チタン膜11をパターニングすることにより、図4 (A)に示すように、受光マトリクス111には、受光部の下部電極208、表示マトリクス121の電極層308、画素電極との接続用電極309、および端子部113の端子603が形成される。これらチタンでなる電極208、308、309、603上には、チタン膜11と概略同一形状にパターニングされたシリコン膜11でなるn層209、310、311、604が形成される。

#### [0060]

受光マトリクス以外の n層 3 1 0、 3 1 1、 6 0 4 は実質的な機能を有しないため、形成しなくともよい。この場合はチタン膜 1 1 とシリコン膜 1 2 のパターニングを別々に行えばよい。しかし、チタン膜 1 1 とシリコン膜 1 2 のパターニングを同時に行うことで、工程が簡略化できる。

[0061]

なお、受光部の n 層 2 0 9 として非晶質シリコンの代わりに微結晶シリコンを 用いることもできる。また、リン等の n 型不純物が添加された窒化珪素、酸化珪素、炭化珪素を用いることができる。

[0062]

この状態の受光領域110および表示マトリクス120の上面図を図7(A)、図11にそれぞれ示す。なお、図7、図11において、n層209、310、311、604は省略されている。

[0063]

図7(A)に示すように、下部電極208は選択線202、信号線206で形成された格子内に、受光画素ごとに分離されて形成されている。また端子部113には、取出し端子601と接続される端子603が形成されている。端子603は端子601と同様に、周辺駆動回路112と接続されていない受光マトリクス111の周囲に沿って、『L』字型に形成されている。図7(A)の線A-A、による断面図が図4(A)に図示されている。

[0064]

図7(B)に示すように、端子601と端子603とは絶縁膜540に形成された複数のコンタクトホールを介して上下間で接続されている。コンタクトが小さいほどアンテナ効果が緩和されるため、端子601と603は複数のコンタクトホール605により接続する。なお。図7(A)の線D-D'による断面図が図7(B)に相当する。コンタクトホール605のピッチは例えば受光画素のピッチと同程度であれば、上部電極を等電位にするのに問題がない。

[0065]

他方、表示マトリクス121には、図11に示すように電極層308が、選択線302、信号線306および、電極307とのコンタクト部を除いた活性層301を覆うように格子状に一体的に形成されている。電極層308は受光部に光が入射するのを防ぐと共に、有効表示領域以外から光が漏れることを防止している。さらに、電極層308は表示マトリクス121外部において、取出し配線602に接続されている。取出し配線602はその電位が一定電位に固定されるた

め、電極層308の電位も一定電位に固定される。これにより、電極層308の下層の選択線302、信号線306の電位の変動によって、電極層308の上層の画素電極の電位が変動することを抑制できる。

# [0066]

次に、チタン膜11、シリコン膜のパターニング終了後、図4(A)に示すように、真性もしくは実質的に真性な非晶質シリコン膜 $14 \times 1 \sim 2 \mu m$ 、ここでは $1.5 \mu m$ の膜厚に形成し、連続してボロンを含んだp型の非晶質シリコン膜 $15 \times 30 \sim 100 n m$ の厚さに、ここでは50 n mの厚さに成膜する。さらに、受光部の上部電極を構成する透明導電膜、ここではITO膜 $16 \times 120 n m$ の厚さに成膜する。そして、これら膜 $14 \sim 16 \times 120 \times 12$ 

#### [0067]

なお、非晶質シリコン膜 14 が実質的に真性な状態とは、ボロン等の p 型不純物を  $5 \times 10^{16} \sim 1 \times 10^{19}$  c m  $^{-3}$  程度添加し、そのフェルミ準位がバンドギャプの中央に位置した状態をいう。これは非晶質シリコンは成膜時にはフェルミ準位がバンドギャプの中央に必ずしも位置している訳ではなく、若干 n 型になる方向にフェルミ準位がずれている。そのため、上記のように p 型不純物を添加することで、フェルミ準位をバンドギャプの中央にすることができる。この場合に不純物が添加されているが、フェルミ準位をバンドギャプの中央にある状態を実質的に真性な状態であるとしている。

#### [0068]

なお、真性または実質的に真正な非晶質シリコン膜14の代わりに非晶質シリコンゲルマニュームを用いることができる。また、p型非晶質シリコン膜15の代わりに微結晶シリコンを用いることもできる。

#### [0069]

次に、レジストマスク17を用いて、ITO膜16、シリコン膜15、14を順次パターニングして、図4(B)に示すように、上部電極212、p層211、 i 層210をそれぞれ形成する。ITO膜16、シリコン膜15、14をパターニングするには、 $CF_4/SF_6/O_2$ を混合したエッチングガスを用いたR

I E エッチングを用いる。なお、I T O 膜 1 6 をパターニングした後は、シリコン膜のみをエッチングするガスを用いることにより、上部電極 2 1 2 をマスクにしてシリコン膜 1 5、1 4 をエッチング可能であるため、レジストマスク 1 7 は不要になる。しかしシリコン膜 1 5、1 4 のエッチング時に、レジストマスク 1 7 を残存させることで、R I E エッチングによって上部電極 2 1 2 が変質することを防止できる。

#### [0070]

本実施例では、シリコン膜15、14とITO膜16とのパターニング工程を連続して行う、即ち、ITO膜成膜前にシリコン膜15、14の成膜の間にパターニング工程を行わないことで、上部電極212と光電変換層210とのパターンずれによる開口率低下を回避することができる。

#### [0071]

また上部電極212とp層211、i層210を、受光マトリクス111内のみでなく、端子部113側に突出させて形成する。これは、後に、開口率を低下することなく、上部電極212を電極604に接続させるためであり、製造マージンや受光部の信頼性を考慮して、端子部113側に突出させる幅は、受光画素のピッチの2~10倍程度とすればよい。

#### [0072]

また、受光部の信頼性の点から、 i 層 2 1 0 において、受光マトリクス1 1 1 の境界部を絶縁化して、受光マトリクス1 1 1 外部の i 層 2 1 0 で発生したフォトキャリアが受光マトリクス1 1 1 内に漏れ込むことを防止すると良い。絶縁化の方法の1つとして、受光マトリクス1 1 1 の境界部に沿って i 層 2 1 0 に溝部を形成し、この溝部に絶縁物を埋め込む方法が挙げられる。この溝部は i 層 2 1 0 を完全に分断するように形成しても良い。なお、上記のように境界部を絶縁化する場合は、シリコン膜 1 4、15のパターニング工程と、I T O 膜 1 6 のパターニング工程を別々に行う必要がある。

#### [0073]

次にレジストマスク17を除去した後、図1に示すように、表示マトリクス1 21の画素電極312の下地となる第3の層間絶縁膜550を基板500全面に 形成する。絶縁膜 550 受光マトリクス 1110 パッシベーション膜としても機能する。第3の層間絶縁膜 550 を構成する絶縁被膜として、ポリイミド、ポリアミド、ポリイミドアミド、アクリル等の樹脂膜を形成して、平坦な表面を得るようにする。本実施例では、ポリイミド膜を形成し、受光マトリクス 1110 での膜厚が、 $0.3\sim1~\mu$  m、ここでは $0.5~\mu$  mとなる成膜にする。

# [0074]

次に層間絶縁膜550に、上部電極212、電極309および端子603に達するコンタクトホールを形成する。ここでは、エッチングガスには $CF_4$ を1~10%混合した $O_2$ ガスを用いたRIEエッチング法を用いる。層間絶縁膜550は樹脂でなるため $O_2$ ガスのみでエッチング可能であるが、 $CF_4$ 混合することにより、電極309、604上のシリコン膜でなるn層310、604もエッチングされる。

#### [0075]

コンタクトホールを開口後、100~300 n m厚さ、ここでは120 n mの I T O 膜をスパッタ法にて成膜し、 $CF_4/SF_6/O_2$ を混合したエッチング ガスを用いてパターニングして、電極 309 に接続された画素電極 312、および上部電極 212 を端子 603 に接続するための取出し端子 606 が形成される。この状態の受光マトリクス 111、表示マトリクス 121 の上面図をそれぞれ、図 8(A)、図 12 に示す。

## [0076]

図8(A)に示すように、取出し端子606は端子603同様、受光マトリクス111の駆動回路121が接続されていない周囲を囲むように、『L』字型に形成されている。そして、端子606は受光マトリクス111外部において上部電極212に接続され、端子部113において端子603に接続されている。この構造により、取出し端子601を一定電位に固定することにより、上部電極212は端子606、603を介して、その電位が一定電位に固定される。例えば、端子601を一定電位に固定するには、端子601を図1に示す取出し端子部130に形成される外部取出し端子に接続する。この場合、外部取出し端子を信号線206、306と同一の導電膜で形成して、外部取出し端子と取出し端子6

01を一体的に形成することも可能である。

[0077]

なお、上部電極212の全体を一定電位にするためには、端子606を接続するためのコンタクトホール607は受光画素のピッチと同程度とすればよい。なお、図8(A)の線D-D'による断面図を図8(B)に示す。また図8(A)の線A-A'による断面図が図1に図示されている。

[0078]

ここで、端子601、603、606は受光マトリクス111が駆動回路121と接続されていない周囲を囲むように形成したため、図1の断面構成からも明らかなように、受光部(フォトダイオード)側面が端子601、端子603、606で囲まれている。ここでは、端子601、端子603、606は電位が一定に固定されているため、受光部に対するシールドとして機能させることができる。よって、表示マトリクス121と受光マトリクス111を同一基板に設けても、受光部の信頼性を保つことができる。

[0079]

さらに、選択線202、信号線302が周辺回路112H、112Vとの接続端の他端も端子601、603、606によって、電気的に保護できるため、受光マトリクス111に配置されるTFTの静電破壊を抑制できる。

[0080]

他方、表示マトリクス121においては、図12に示すように、画素電極312は表示画素ごとに電気的に分離され、その周縁が電極層308と重なるように形成される。この構造により、絶縁膜550を誘電体とし、電極層308、画素電極312を対向電極とする補助容量が形成できる。なお、図12において電極層308上のn層309は省略されている。

[0081]

実施例において、受光マトリクス111をTFTを作製した後、TFT上に受 光部(フォトダイオード)を形成する積層型としたので、従来のように受光部を 非晶質シリコン膜で形成しても、受光TFT200を多結晶シリコンで構成する ことができる。よって、ガラス基板等の絶縁性基板上に、変換効率が良く、高速 応答可能なイメージセンサが作製できる。

[0082]

また、イメージセンサを積層構造とすることで、従来多結晶シリコンTFTで 構成されている液晶パネルの作製工程と整合性が保たれる。従って、イメージセ ンサと液晶パネルの各特性を損なうことなく同一基板上に集積化できる。

[0083]

本実施例では、受光マトリクス111に受光画素を2次元に配列したが、受光 画素を1次元に配列したラインセンサとしても良い。また、受光画素のフォーマットを表示部のフォーマットと同一にすると、受光画素と表示画素が1対1に対 応するため、受光マトリクス111で検出された画像を表示マトリクス121に 表示するための信号処理が簡単化、高速化できる。ラインセンサとした場合も、 受光画素数は、列方向又は行方向の表示画素数と同じにすると良い。

[0084]

画素フォーマットを一致させた場合には、例えば表示マトリクス121のフォーマットを640×480 (VGA規格) とし場合には、1つの受光画素ピッチを10μm程度とすると、受光マトリクス111の占有面積は6.4mm×4.8mm程度となり、液晶パネルに集積化することは可能である。

[0085]

本実施例では、受光部を抵抗型のフォトダイオードとしたため、下部電極20 8、上部電極とオーミック接合させる n層209、 p層211を設けたが、例えばショットキー型とする場合は、 n層209、 p層211を省略すればよい。

[0086]

本実施例では、透過型液晶パネルとしたが、画素電極312を鏡面表面を有する反射型電極とし、直視型の液晶パネルとすることもできる。

[0087]

本実施例では、受光マトリクス111において、受光部(フォトダイオード)と接続される信号読出し回路として、スイッチング素子として機能するTFTを 1つ設けたパッシブ型としたが、例えば、増幅機能を有するアクティブ型とし、 複数のTFTで構成することもできる。 [0088]

[実施例2] 本実施例は、受光領域111の端子部113の変形例である。本 実施例を図15を用いて説明する。

[0089]

本実施例では、信号線306と同じ出発膜でなる端子601を省略する。この場合、最下層の配線701は電極層308と同一の出発膜でなる配線となる。配線701の形状は、実施例1の端子601と同様とし、受光マトリクス111外部へ延長して、外部取出し端子部130に形成される端子と接続するようにすればよい。

[実施例3] 本実施例は、受光領域111の端子部113の変形例である。本 実施例を図16を用いて説明する。

[0090]

本実施例では、端子601及び電極308を省略する。この場合、端子部113に配置される配線801は画素電極312と同一の出発膜でなる配線のみとなる。配線801の形状は、実施例1の端子601と同様とし、受光マトリクス11外部に延在して、外部取出し端子部130に形成される端子と接続するようにすればよい。

[実施例4] 本実施例は、受光領域111の端子部113の変形例である。実施例1では端子部の最下層の端子601と信号線306と同じ出発膜で形成したが、選択線302と同じ出発膜で構成することも可能である。

[0091]

[実施例5] 本実施例の受光領域111の端子部113の変形例である。実施例1において電極層308と同じ出発膜でなる端子603を省略して、端子606と端子601を直接に接続する。また、この場合、実施例4で述べたように、端子601を選択線302と同じ出発膜で構成することも可能である。

[0092]

[実施例6] 本実施例は、実施例1で説明した、イメージセンサー体型の液晶パネルの応用製品を説明する。図17に本実施例の電子機器の模式的な外観図を示す。

[0093]

実施例1の液晶パネルは撮像機能を有する受光領域と、表示領域が一体的に設けられているため、TV会議システム、TV電話、インターネット用端末やパーソナルコンビュータ等の通信機能を備えた表示部に好適である。例えば、表示部で対話者の端末から送信された映像を見ながら、受光マトリクスで自身の姿を撮影して、対話者の端末にその映像を転送することできるので、動画像を双方向通信することが可能である。

[0094]

またこのような電子機器の1つとして、図17(A)に、液晶パネルを有する ノート型パソコン2000を示す。2001が液晶パネルであり、2002がイ メージセンサ部である。

[0095]

また他の電子機器として、図17(B)に、テレビ電話2010を示す。20 11が液晶パネルであり、2012がイメージセンサ部である。使用者は自身の 姿を姿をイメージセンサ部2012で撮影しつつ、また液晶パネルにて2011 通話相手の姿を見ながら通話することができる。

[0096]

更に図17(C)にはペン入力型の携帯型情報端末機器2020を示す。2021が液晶パネルであり、2021がエリアセンサ部である。エリアセンサ2021により、名紙等の文字・図画情報を取り込んで、液晶パネル2021に表示したり、携帯型情報端末機器内にこれらの情報を保存できるようになっている。

[0097]

本発明では液晶パネルとセンサ部を同一基板に設けたため、小型、軽量でとすることができる。またセンサ部の駆動を液晶パネルと共有化することも可能であるため、省電力化が図れる。よって、図17で示したような、バッテリー駆動型の電子機器に本発明は好適である。

[0098]

【発明の効果】

本実施形態では、表示マトリクスと受光マトリクスを同一基板上に形成するた

めに、成膜プロセス及びパターニングプロセスを各マトリクスとで共通化することで、製造コストを安価におさえることができる。

#### [0099]

また本実施形態では、受光部の上部電極の電位を固定するための取出し端子を 上部電極と一体的に形成しないことにより、受光部の上部電極と光電変換層との パターニングを連続して行うことが可能になり、マスクずれによる開口率の低下 を防止できる。さらにこの取出し端子を表示マトリクスの画素電極と同一出発膜 で形成することにより、プロセスの簡略化が図れる。

# 【図面の簡単な説明】

- 【図1】 実施例1の液晶パネルの断面図。
- 【図2】 実施例1の液晶パネルの正面図。
- 【図3】 実施例1の液晶パネルの作製工程を説明するための断面図。
- 【図4】 実施例1の液晶パネルの作製工程を説明するための断面図。
- 【図5】 実施例1の受光マトリクスの作製工程の説明するための正面図。
- 【図6】 実施例1の受光マトリクスの作製工程の説明するための正面図。。
- 【図7】 実施例1の受光マトリクスの作製工程の説明するための正面図及び断面図。
- 【図8】 実施例1の受光マトリクスの作製工程の説明するための正面図及び断面図。。
- 【図9】 実施例1の表示マトリクスの作製工程の説明するための正面図。
- 【図10】実施例1の表示マトリクスの作製工程の説明するための正面図。
- 【図11】実施例1の表示マトリクスの作製工程の説明するための正面図。
- 【図12】実施例1の表示マトリクスの作製工程の説明するための正面図。
- 【図13】実施例1の駆動回路の作製工程を説明するための正面図。
- 【図14】実施例1の駆動回路の作製工程を説明するための正面図
- 【図15】実施例2のの液晶パネルの断面図
- 【図16】実施例3のの液晶パネルの断面図
- 【図17】実施例6の液晶パネルの応用製品の模式的な外観図。

#### 【符号の説明】

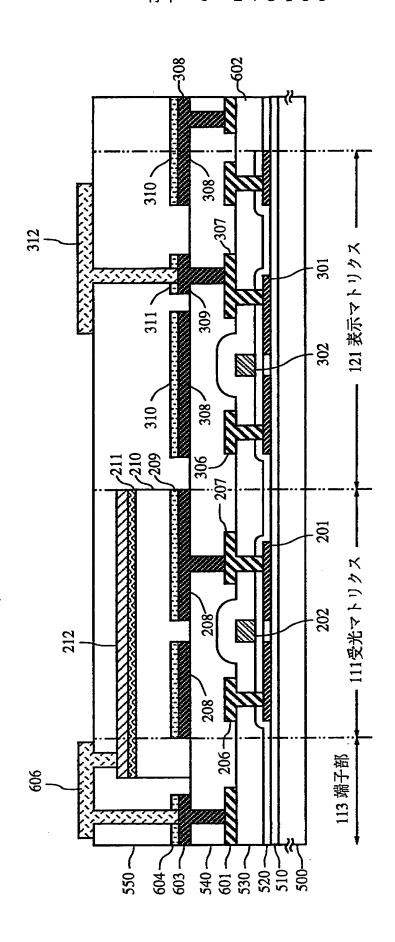
# 特平:9-273458

- 110 受光領域
- 111 受光マトリクス
- 112 周辺駆動回路
- 113 端子部
- 120 画素領域
- 121 表示マトリクス
- 122 周辺駆動回路
- 201 活性層
- 202 選択線
- 206 信号線
- 207 ソース電極
- 208 下部電極
- 209 n層
- 210 i層
- 211 p層
- 212 上部電極
- 301 活性層
- 302 選択線
- 306 信号線
- 307 ドレイン電極
- 308 電極層
- 309 電極
- 3 1 2 画素電極
- 601、603、606 取出し端子

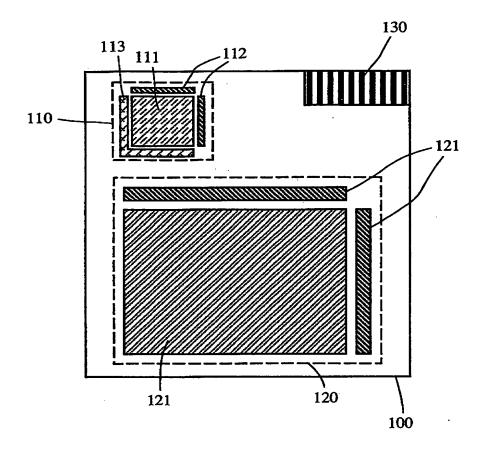
【書類名】

図面

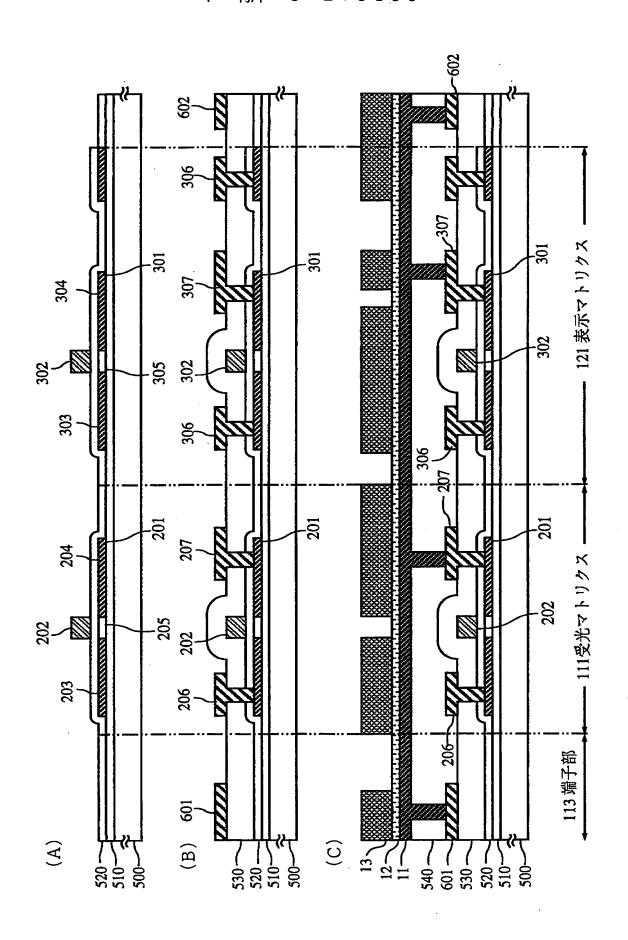
【図1】



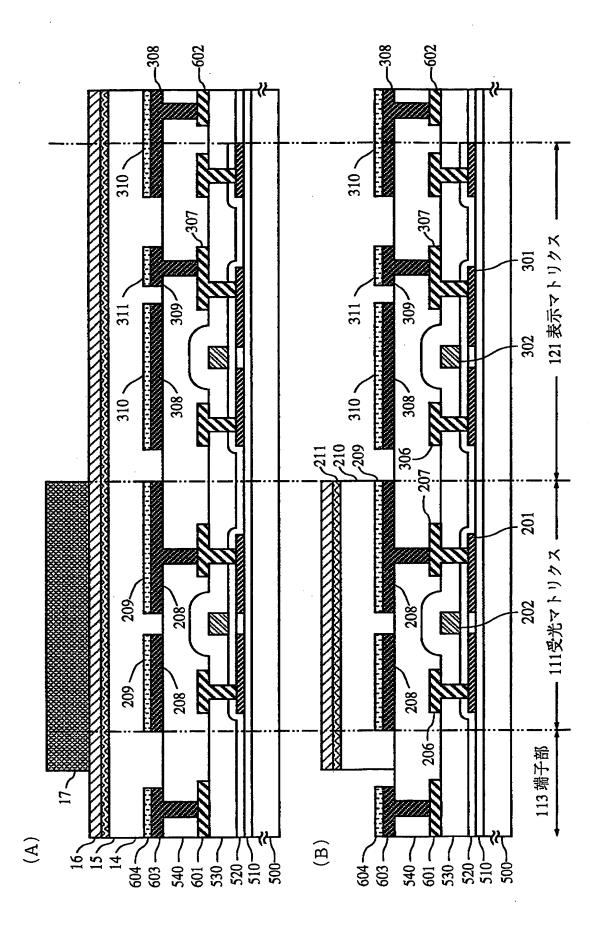
【図2】



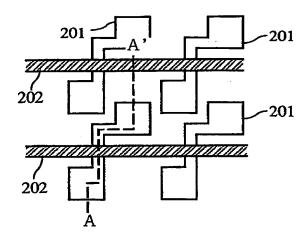
【図3】



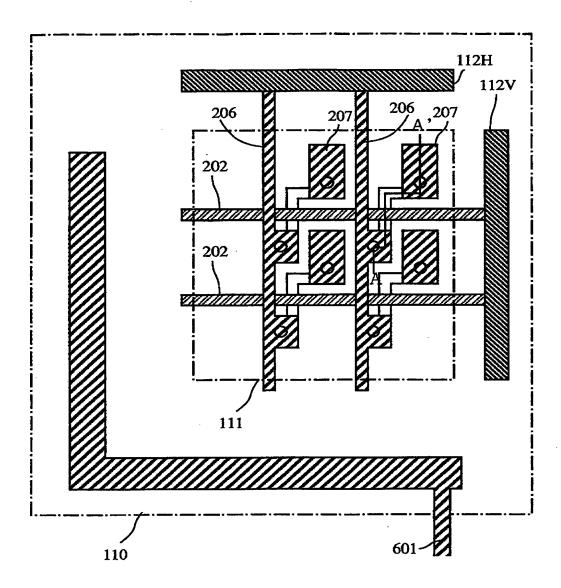
【図4】



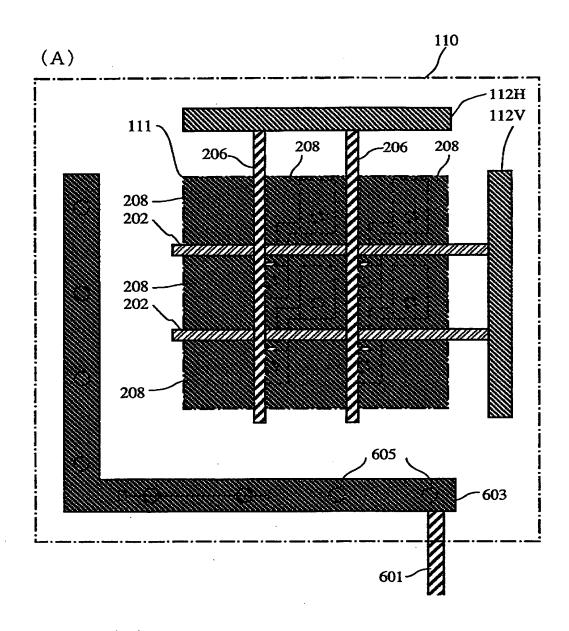
【図5】

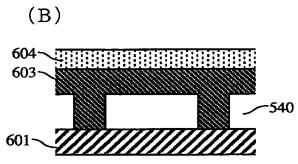


【図6】

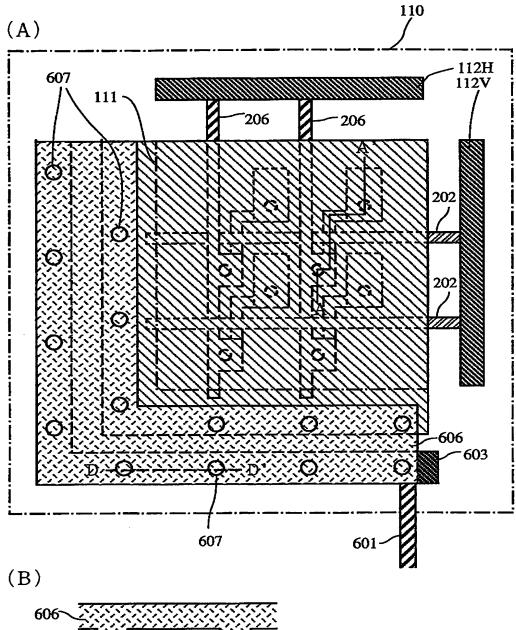


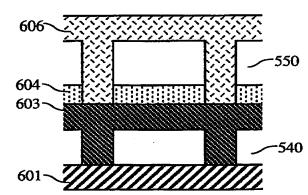
【図7】



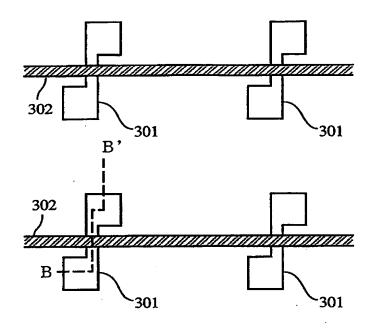


【図8】

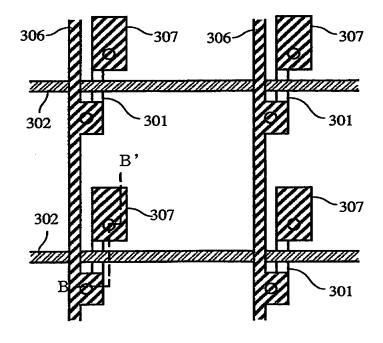




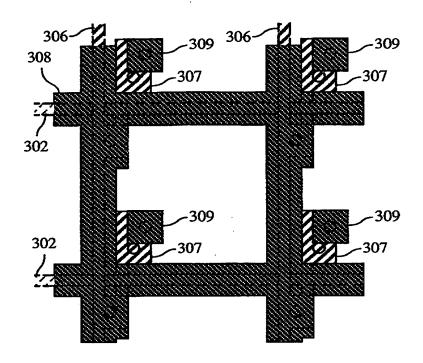
[図9]



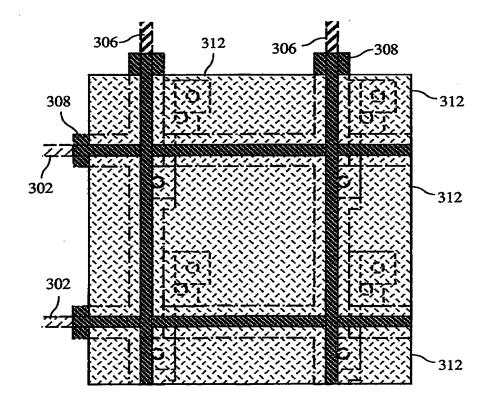
[図10]



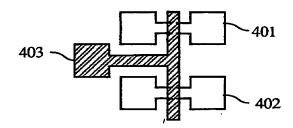
【図11】



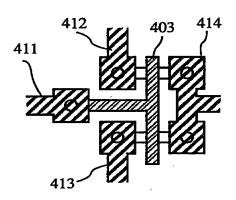
【図12】



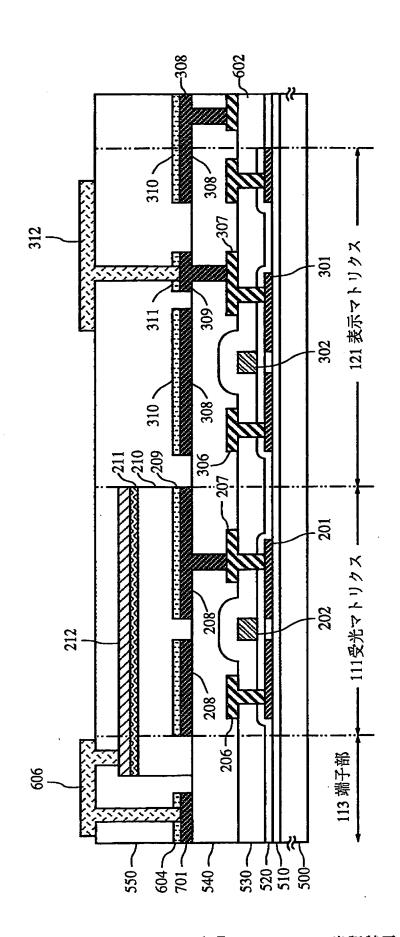
【図13】



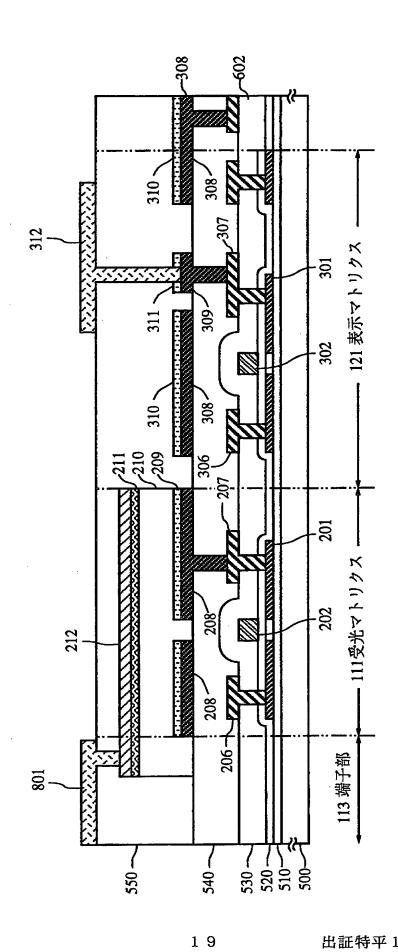
【図14】



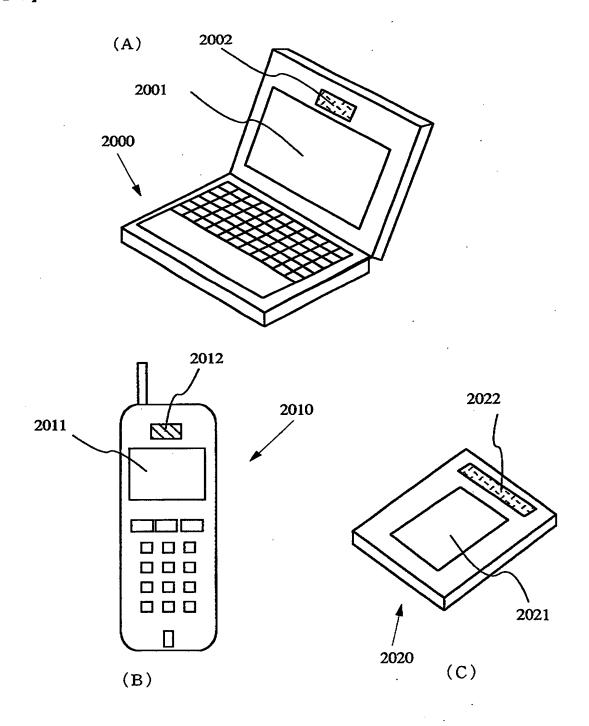
【図15】



【図16】



【図17】



## 【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 イメージセンサを一体化したアクティブマトリクス型表示装置を、安価に、且つプロセスを複雑化せずに作製する。

【解決手段】 受光マトリクス111には、TFTと受光部が積層されたイメージセンサが形成される。表示マトリクス121には、TFTと画素電極312がマトリクス上に配置され、ブラックマトリクスとして機能する電極層308が形成されている。受光部の下部電極208は遮光膜308と同一の出発膜で形成される。上部電極212の電位を固定するための端子606、603、601はそれぞれ、信号線306、電極層308、画素電極606と同一の出発膜で形成される。端子606、603、601はその電位が固定されるため、受光部の側面のシールド電極としても機能する。

【選択図】 図1

## 特平: 9-273458

【書類名】

職権訂正データ

【訂正書類】

特許願

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

申請人

【識別番号】

000153878

【住所又は居所】

神奈川県厚木市長谷398番地

【氏名又は名称】

株式会社半導体エネルギー研究所

## 出願人履歴情報

識別番号

[000153878]

1. 変更年月日 1990年 8月17日

[変更理由] 新規登録

住 所 神奈川県厚木市長谷398番地

氏 名 株式会社半導体エネルギー研究所